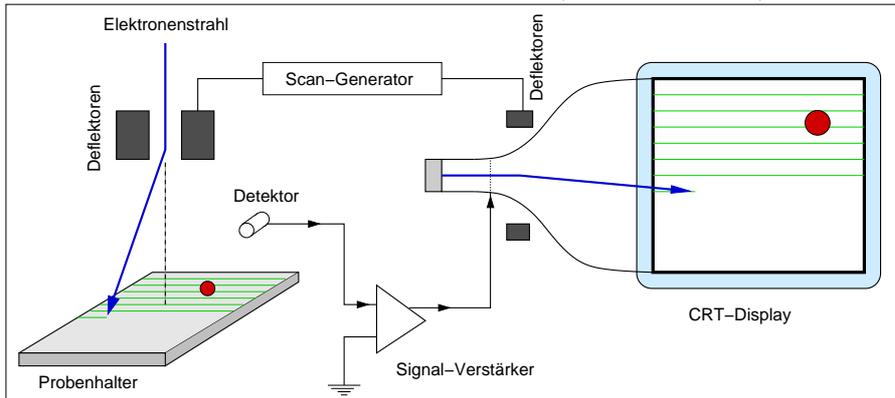


III. Bildgebende Verfahren (Mikroskopie)

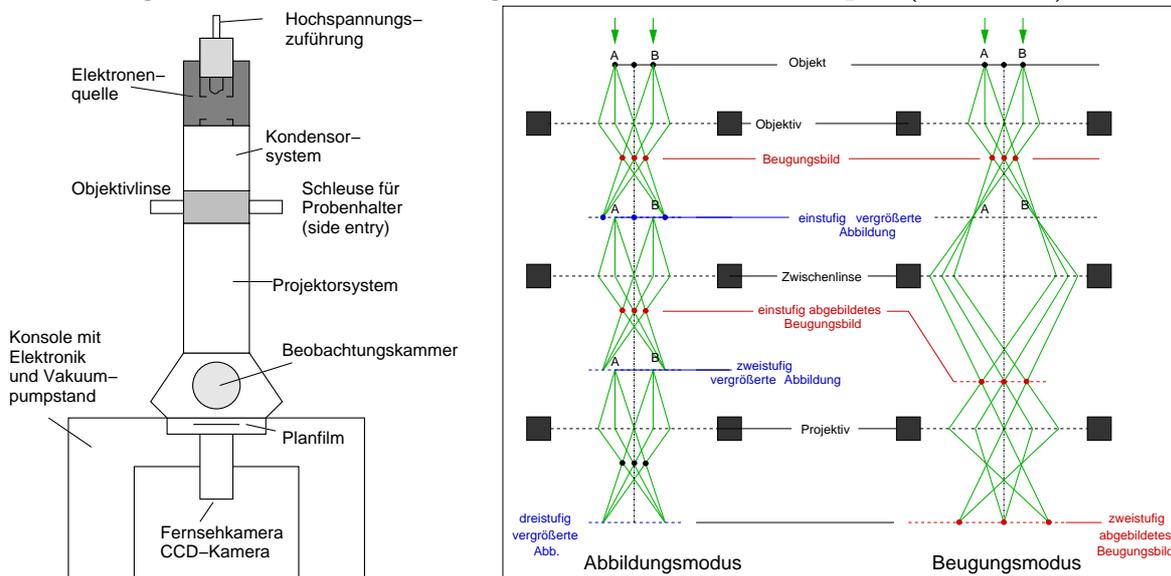
3. Elektronenmikroskopie

3.1 Raster-Elektronenmikroskopie (REM=SEM)



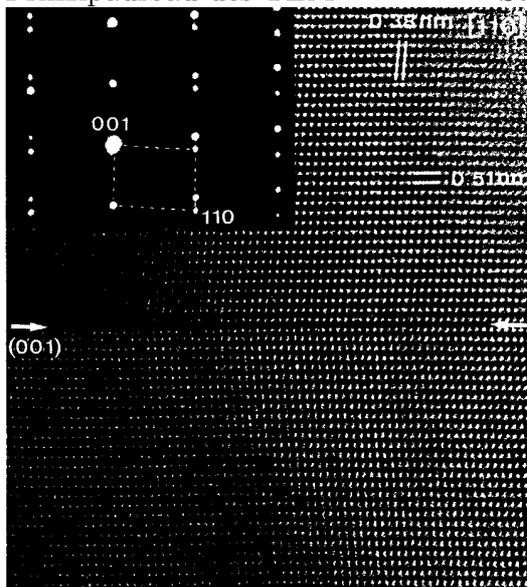
Funktionsprinzip des Rasterelektronenmikroskops

Hochaufgelöste Durchstrahlungs-Elektronenmikroskopie (HRTEM)

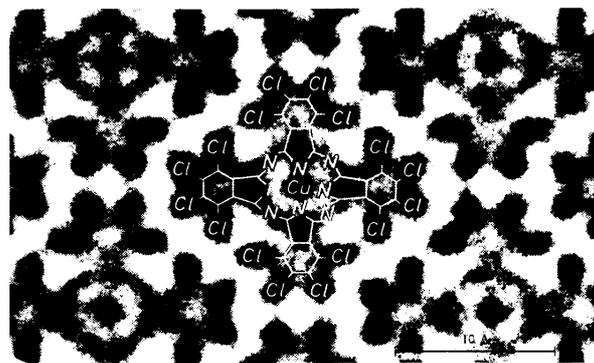


Prinzipaufbau des TEM

Strahlengänge im TEM



TEM-Aufnahme einer Zwillings Ebene (entlang (001)) in $YTaO_4$ (links oben: Beugungsmuster)



Durchstrahlungsaufnahme von chloriertem Kupferphthalocyanin (500 kV, Aufnahme \perp c-Achse)